(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl.[6]
G01R 31/28

(11) 공개번호 특1996-0032016
(43) 공개일자 1996년09월17일

(21) 출원번호 특1995-0004180
(22) 출원일자 1995년02월28일

(71) 출원인 대우전자 주식회사 배순훈
서울특별시 중구 남대문로 5가 541 (우:100-095)
(72) 발명자 김봉석
경상북도 구미시 송정동 454-1 우방타운1차 9/306
(74) 대리인 구명환

심사청구 : 없음

(54) 고밀도 인쇄회로기판(PCB)의 오픈 및 쇼트 검사방법

요약

본 발명은 고밀도 인쇄회로기판의 동박 양측에 검사용 접촉핀을 세우지 않고 한쪽의 동박에만 접촉핀을 세워 동박과 패드의 오픈 및 쇼트를 검사하기 위한 고밀도 인쇄회로기판의 오픈 및 쇼트 검사방법에 관한 것으로, 간격(△t)이 협소한 고밀도 인쇄회로기판(10) 동박(A,B)과 패드(20)(20-1)의 오픈 및 쇼트를 접촉핀(30)에 연결된 저항측정기(40)로 검사하는 방법에 있어서, 상기 동박(A,B)에 전도성물질(60)을 올려놓고 동박(a,b)에 접촉핀(30)(30-1)을 세워 동박(A,B)과 패드(20)(20-1)의 오픈 및 쇼트를 검사하여 동박패드의 불량 발생률을 없애 인쇄회로기판의 품질향상에 기여할 수 있는 것이다.

대표도

도2

명세서

[발명의 명칭]

고밀도 인쇄회로기판(PCB)의 오픈 및 쇼트 검사방법

[도면의 간단한 설명]

제2도의 (가)도는 본 발명에 따른 인쇄회로기판 동박과 패드를 검사하기 위한 접촉핀 연결 상태도,

(나)도는 동박(A,B)에 전도성 물질을 접촉시킨 상태도,

(다)도는 본 발명에 따른 인쇄회로기판의 동박패드를 검사하기 위한 회로도.

본 내용은 요부공개 건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음.

(57) 청구의 범위

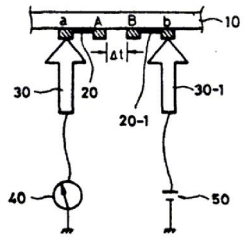
청구항 1

간격(△t)이 협소한 고밀도 인쇄회로기판(10) 동박(A,B)과 패드(20)(20-1)의 오픈 및 쇼트를 접촉핀(30)에 연결된 저항측정기(40)로 검사하는 방법에 있어서, 상기 동박(A,B)에 전도성물질(60)을 올려놓고 동박(a,b)에 접촉핀(30)(30-1)을 세워 동박(A,B)과 패드(20)(20-1)의 오픈 및 쇼트를 검사함을 특징으로 하는 고 밀도 인쇄회로기판(PCB)의 오픈 및 쇼트 검사방법.

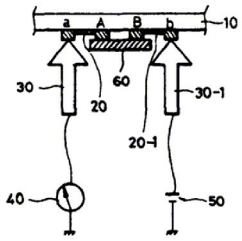
※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임

도면

도면2-가



도면2-나



도면2-다

